

10/089007

ST/JP00/06957

日本国特許庁 05.10.00

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JP00/6957

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年10月 5日

REC'D 28 NOV 2000

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第284859号

WIPO PCT

出願人
Applicant(s):

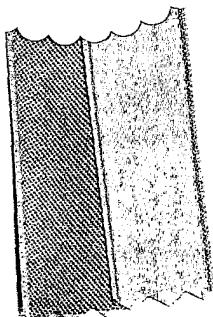
ティーディーケイ株式会社

EV

**PRIORITY
DOCUMENT**

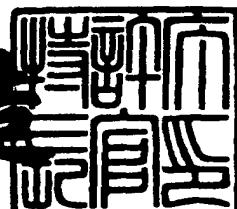
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年11月10日



特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3092513

【書類名】 特許願
【整理番号】 P00689
【提出日】 平成11年10月 5日
【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿
【国際特許分類】 B23K 35/36
B23K 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

【氏名】 阿部 寿之

【特許出願人】

【識別番号】 000003067

【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081606

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 美次郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014513

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 はんだ付け用フラックス、はんだペースト及びはんだ付け方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 接着性樹脂と、硬化剤とを含有するはんだ付け用フラックス

【請求項2】 請求項1に記載されたフラックスであって、液状またはペースト状であるフラックス。

【請求項3】 請求項1または2の何れかに記載されたフラックスであって、前記接着性樹脂は、熱硬化性樹脂を含む
フラックス。

【請求項4】 請求項3に記載されたフラックスであって、
前記熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、シリコン樹脂、変性樹脂またはアクリル樹脂から選択された少なくとも一種を含む
フラックス。

【請求項5】 請求項4に記載されたフラックスであって、
前記硬化剤は、カルボン酸を含む
フラックス。

【請求項6】 はんだ粉末と、フラックスとを含むはんだペーストであって
前記フラックスは、請求項1乃至5の何れかに記載されたものなり、
前記はんだ粉末は、前記フラックスと混合されている
はんだペースト。

【請求項7】 請求項6に記載されたはんだペーストであって、
前記はんだ粉末は、Sn、Cu、Ag、Sb、Pb、InまたはBiから選択
された少なくとも一種を含む
はんだペースト。

【請求項8】 請求項1乃至5の何れかに記載されたフラックスを用いては
んだ付けする方法。

【請求項9】 請求項6または7の何れかに記載されたはんだペーストを用

いてはんだ付けする方法。

【請求項10】 請求項8または9の何れかに記載された方法であって、
部品搭載基板の上に電子部品をはんだ付けする
はんだ付け方法。

【請求項11】 請求項10に記載された方法であって、
前記部品搭載基板の一面上に、前記はんだペーストによるはんだ付け処理を実
行し、

次に、前記部品搭載基板の他面上で、前記はんだペーストとは異なるはんだを
用いて、電子部品をはんだ付けする
工程を含むはんだ付け方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、はんだ付け用フラックス、はんだペースト及びはんだ付け方法に關
する。

【0002】

【従来の技術】

例えば、部品搭載基板に対する部品のはんだ付けに当たっては、周知のよう
に、フラックスが用いられる。フラックスの主な機能は、部品搭載基板に設けられ
た金属導体及び部品のはんだ付け用金属の表面の酸化皮膜を除去し、はんだの濡
れ性を向上させることにある。フラックスとしては、ロジンを主成分とするもの
が最もよく知られている。ロジンには、アビエチン酸、レボビマル酸等のカルボ
ン酸が含まれており、カルボキシル基の働きにより、はんだ付けされる金属表面
の酸化膜を除去する。

【0003】

フラックスには、通常、上述したロジンの外、印刷性の向上及び仮止め強度を
得る目的で、溶剤、可塑剤またはチキソ剤等の各種の添加物が配合される。例え
ば、特開平11-121915号公報は、粘性を、アルコール添加によって調整
するタイプのフラックスを開示している。

【0004】

更に、別のフラックスとして、ミル規格で規定されているRMA（ハロゲンフリー）系フラックスも知られている。このフラックスの場合、リフロー後、フラックス等の洗浄工程が省略される。

【0005】

上述したフラックスは、はんだ付け後は、はんだ付けされた部品の接着に関与せず、はんだ接合は、はんだ金属の溶融接合によって達成される。従って、はんだ付けされる金属間の接合強度は、はんだ接合面積に依存する。

【0006】

ところが、各種電子機器において、高密度実装が進むにつれ、部品が小型化され、部品の配置間隔が狭ピッチ化され、これに伴い、はんだ接合面積の狭小化が急速に進展しつつあり、現段階でも、既に、十分なはんだ付け強度を確保することが困難になっている。しかも、実装の高密度化、部品の小型化及び部品の配置間隔の狭ピッチ化は、更に進展する傾向にあり、はんだ接合面積のみによってははんだ接合強度を確保する従来手段では、この技術動向に対応することが、ますます困難になる傾向にある。

【0007】

一般に、はんだ接合強度を確保する手段として、はんだのフィレット部を形成し、部品の端子と部品搭載基板上の導体（ランドまたははんだバンプ）とのはんだ接合面積を拡大する手段が採られている。ところが、高密度実装においては、フィレット部の接合面積も小さくなってしまうため、フィレット部による接合強度の増大手段も採りにくい。

【0008】

更に、例えば、各種のモジュール等では、両面実装タイプの部品搭載基板を用い、部品搭載基板の一面上に高温はんだを用いてモジュール構成用の部品をはんだ付け（通炉）した後、他面に部品を搭載し、再び通炉する。従って、部品搭載基板の他面側における部品のはんだ付けに当たっては、一面側の高温はんだよりも低い融点を持つ低温はんだを用いてはんだ付けする必要がある。従来、はんだの融点はPbの含有量によって調整するのが一般的であった。

【0009】

ところが、地球環境保全の立場から、Pbを含有しないはんだ（Pbフリーはんだ）が要求され、そのようなはんだ組成の開発が盛んに行われている。しかし、Pbフリーはんだで、従来の高温はんだに匹敵する高温融点のはんだ組成は、現在のところ、実用化されていない。理由として、Pbフリーはんだ自体の融点が220℃前後と、共晶はんだに比較し、約40℃も上昇するため、Pb以外の代替え組成が見つからないからである。このため、両面実装タイプの部品搭載基板において、両面側で用いられるはんだの融点差を十分にとることができず、モジュール構成用の部品を部品搭載基板上に実装する際、部品が浮動し、または脱落する等の不具合が生じる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、実装の高密度化、部品の小型化及び部品の配置間隔の狭ピッチ化等に対しても、十分な接合強度をもって対応し得るはんだ付け用フラックス及びはんだペースト及びはんだ付け方法を提供することである。

【0011】

本発明のもう一つの課題は、両面実装タイプの部品搭載基板において、両面側で用いられるはんだの融点差を十分にとらなくとも、部品の浮動または脱落等の不具合を確実に阻止し得るはんだ付け用フラックス及びはんだペースト及びはんだ付け方法を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上述した課題を解決するため、本発明に係るはんだ付け用フラックスは、接着性樹脂と硬化剤とを含有する。

【0013】

本発明に係るフラックスは、接着性樹脂と、硬化剤とを含有するから、はんだ付け後に、接着性樹脂を、部品搭載基板と部品を固定する接着剤として機能させることができる。このため、衝撃や熱ストレスに対し、部品の剥離、脱落を防ぎ、はんだ接合の信頼性を向上させることができる。この点、はんだ付け後に、接

着機能を持たない従来のロジン系フラックスと著しく異なる。

【0014】

しかも、本発明に係るフラックスを使用することにより、フィレット部がなくとも、十分な固着強度を確保できる。このため、部品搭載基板上に形成される部品接続用導体（ランド）に、フィレット部を生じさせるための領域を設ける必要がなくなるので、実装密度を向上させることが可能となる。

【0015】

本発明に係るフラックスにおいて、接着性樹脂としては、多数の樹脂材料から、温度に応じて、高い接着力を示す樹脂を選択し、これを接着性樹脂として用いることができる。従って、両面実装タイプの部品搭載基板の1面目に本発明に係るフラックスを用いて、部品をはんだ付けした後、部品搭載基板の2面目に通常の共晶はんだを用い、リフロー炉を通炉した場合でも、1面目に搭載された部品がシフティング、マンハッタン現象（部品立ち現象）または脱落等の不具合を起こすことはない。勿論、1面目及び2面目の両はんだ付け処理において、本発明に係るフラックスを用いることができる。

【0016】

本発明に係るフラックスは液状またはペーストの形態を探ることができる。このようなフラックスは、印刷、ディスペンサー塗布、スプレー、はけ塗り等の手段によって、部品搭載基板等に容易に塗布できる。

【0017】

本発明に係るフラックスにおいて、好ましい接着性樹脂は、熱硬化性樹脂である。熱硬化性樹脂の具体例としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、シリコン樹脂または変性樹脂またはアクリル樹脂から選択された少なくとも一種を挙げることができる。例示された樹脂材料の種類及び配合量は、接着温度帯及び目標とする皮膜硬度等に応じて選択することができる。

【0018】

硬化剤は、接着性樹脂を硬化させるものであればよい。好ましくは、カルボン酸を含む。カルボン酸を含む硬化剤は、熱硬化性樹脂に対する硬化作用のみならず、はんだ付けされる金属表面の酸化膜を除去するフラックス作用も兼ね備える

【0019】

本発明に係るフラックスは、溶剤、可塑剤及びチキソ剤等を含んでいてもよい。溶剤は、接着性樹脂の硬化温度及び硬化速度を調整すると共に、塗布形態に応じて粘度を調整するために加えられる。可塑剤及びチキソ剤も、塗布形態に応じて、粘度を調整するために加えられる。溶剤、可塑剤及びチキソ剤等は、その使用目的に合うように、配合量が選択される。

【0020】

本発明に係るフラックスは、接着性樹脂、還元作用をもたらす有機酸、カルボン酸、溶剤または硬化剤を封入したマイクロカプセルの形態であってもよい。

【0021】

更に、本発明に係るフラックスは、はんだ粉末と混合して、はんだペーストを構成するために用いることもできる。はんだ粉末は、Sn、Cu、Ag、Sb、Pb、In及びBiから選択することができる。Pbフリーのはんだペーストを得る場合には、はんだ粉末はPb以外のはんだ粉末で構成する。

【0022】

本発明は、更に、上述したフラックス及びはんだペーストを用いたはんだ付け方法についても開示する。

【0023】

【発明の実施の形態】

実施例1

熱硬化性樹脂としてビスフェノールAを用い、硬化剤にはカルボン酸の無水物を使用した。熱硬化性樹脂及び硬化剤の配合比は重量比で1:1とした。また、粘性を確保するために、少量の溶剤及びチクソ剤を配合した。

【0024】

上記組成にて調製したフラックスを、予め、はんだバンプ21、22を施した部品搭載基板1(図1(a)参照)の上に塗布3(図1(b)参照)した。次に、図1(c)に示すように、長さ1mm、幅0.5mmのチップ状の電子部品4を搭載した。電子部品4は、基体40の相対する両端に端部電極41、42を有

し、端部電極41、42がはんだバンプ21、22上に位置するようにして、部品搭載基板1上に配置した。電子部品4を搭載した部品搭載基板1を、リフロー炉に通炉し、電子部品4の基体40の両端に設けられた端部電極41、42をはんだバンプ21、22にはんだ接合した。この後、図2に示すように、電子部品4を横方向F1に押し、部品横押し強度を測定した。

【0025】

比較例1

比較のために、従来のロジン系フラックスを用い、図1に従って部品を搭載し、はんだ付け処理を行い、次に、図2に示した試験方法に従い、部品横押し強度を測定した。

【0026】

図3は横押し強度試験結果を示している。図3に示すように、従来のロジンフラックスを用いた比較例1の横押し強度平均値は800g程度であったが、本発明に係るフラックスを使用した実施例1では、平均値1600g程度の横押し強度を得ることができた。

【0027】

実施例2

実施例1で調製したフラックスと、はんだ粉末とを混合し、はんだペーストを調製した。はんだ粉末に対するフラックスの配合量は10wt%とした。このはんだペーストを用いて、チップ部品を部品搭載基板上にはんだ付けした。図4(a)～(c)は部品搭載基板の詳細と、部品搭載基板に対するチップ部品のはんだ付け工程を示す部分断面図である。部品搭載基板1は、Cu膜51(52)、Ni膜61(62)及びAu膜71(72)を順次に積層して形成した2つのランドを有する。

【0028】

上述した部品搭載基板1のランドの上に、本発明に係るはんだペースト81(82)を塗布した(図4(a)参照)。はんだペースト81(82)の塗布に当たっては、厚み100μmのメタルマスクを用いて印刷した。メタルマスクの開口寸法は0.5mm×0.3mmとし、電子部品4の搭載されるランド寸法と同

寸法とした。

【0029】

そして、はんだペースト81(82)の上に、長さ1mm、幅0.5mmの電子部品4を搭載(図4(b)参照)し、リフロー炉に通炉することにより、電子部品4を部品搭載基板1上にはんだ付けした(図4(c)参照)。この後、図2に示した方法に従って横押し強度を測定した。図4(c)において、参照符号3は、はんだペースト81(82)に含まれていた本発明に係るフラックスを示し、端部電極41、42の外側でフィレット状になる。

【0030】

比較例2

比較のため、従来のロジン系フラックスを含むはんだペーストを用い、チップ部品を部品搭載基板にはんだ付けした。はんだ粉末に対するロジン系フラックスの配合量は10wt%とした。

【0031】

図5(a)～(c)は部品搭載基板の詳細と、部品搭載基板に対するチップ部品のはんだ付け工程を示す部分断面図である。図示するように、部品搭載基板1は、Cu膜51(52)、Ni膜61(62)及びAu膜71(72)を順次に積層した2つのランドを有する。この部品搭載基板1のランドの上に、ロジン系フラックスを含有するはんだペースト91(92)を塗布した(図5(a)参照)。

【0032】

そして、ロジン系フラックスを含有するはんだペースト91(92)の上に、長さ1mm、幅0.5mmの電子部品4を搭載(図5(b)参照)し、リフロー炉に通炉することにより、電子部品4を部品搭載基板1上にはんだ付けした(図5(c)参照)。この後、図2に示した方法に従って、部品横押し強度を測定した。

【0033】

図6は実施例2及び比較例2の部品横押し強度試験の結果を示す図である。図示するように、比較例2の横押し強度の平均値は600g程度であったが、実施

例2では平均値1500g程度の強度を得ることができた。

【0034】

実施例3

実施例1で調製したフラックスと、はんだ粉末とを混合し、はんだペーストを調製した。はんだ粉末に対するフラックスの配合量は、20~45wt%まで増やした。

【0035】

このはんだペーストを用い、図7に従って、電子部品4を部品搭載基板1に搭載し、はんだ付けした。図7を参照して具体的に述べると、部品搭載基板1は、Cu膜51(52)、Ni膜61(62)及びAu膜71(72)を順次に積層して形成した2つのランドを有する(図7(a)参照)。

【0036】

上述した部品搭載基板1のランドの上に、本発明に係るはんだペースト81(82)を塗布した(図7(a)参照)。はんだペースト81(82)の塗布に当たっては、厚み100μmのメタルマスクを用いて印刷した。メタルマスクの開口寸法は0.5mm×0.3mmとし、電子部品4の搭載されるランド寸法と同寸法とした。

【0037】

そして、はんだペースト81(82)の上に、長さ1mm、幅0.5mmの電子部品4を搭載(図7(b)参照)し、リフロー炉に通炉することにより、電子部品4を部品搭載基板1上にはんだ付けした(図7(c)参照)。

【0038】

はんだ付け後の外観は、図8に示す通りである。図8は図7(c)の8-8線に沿った断面図である。実施例3では、意図的にフラックス含有量を増やしたはんだペーストを用いたものであるが、実質、はんだ量が少なくて済み、電子部品4は、図8に示すように、傾斜することなく、正常な状態ではんだ付けされた。図7(c)及び図10において、参考符号3は、はんだペースト81(82)に含まれていた本発明に係るフラックスを示し、端部電極41、42の外側でフィレット状になる。

【0039】

また、本発明に係るフラックスを含有するはんだペーストを用いたことにより、はんだ付け後の電子部品4の周辺を、フラックスが覆い、部品横押し強度の向上も認められた。このように、はんだペースト中のフラックス含有率を故意に向上させることにより、はんだ厚みを、はんだペーストによって制御も可能となる。特に、フラックスの含有量が35wt%以上の領域で、斜めはんだ付けを回避し、かつ、従来品と同等以上の接合強度を得ることができた。

【0040】

比較例3

比較のために、従来のロジン系フラックス含有のはんだペーストを用い、図9に従って、電子部品4を部品搭載基板1に搭載し、はんだ付けした。図9を参照して具体的に述べると、部品搭載基板1は、Cu膜51(52)、Ni膜61(62)及びAu膜71(72)を順次に積層して形成した2つのランドを有する(図9(a)参照)。

【0041】

上述した部品搭載基板1のランドの上に、ロジン系フラックス含有のはんだペースト91(92)を塗布した(図9(a)参照)。はんだペースト91(92)の塗布に当たっては、厚み100μmのメタルマスクを用いて印刷した。メタルマスクの開口寸法は0.5mm×0.3mmとし、電子部品4の搭載されるランド寸法と同寸法とした。

【0042】

そして、はんだペースト91(92)の上に、長さ1mm、幅0.5mmの電子部品4を搭載(図9(b)参照)し、リフロー炉に通炉することにより、電子部品4を部品搭載基板1上にはんだ付けした(図9(c)参照)。

【0043】

リフローはんだ付け後の外観は、図10に示す通りである。図10は図9(c)の10-10線に沿った部分断面図である。図10に示すように、従来のロジン系フラックス含有はんだペーストではんだ付けしたものは、はんだ量が多すぎ、電子部品4が斜めにはんだ付けされた。図9(c)及び図10において、参照

符号93は、はんだペースト91(92)に含まれていたロジン系フラックスを示す。

【0044】

実施例4

フラックスの配合組成について検討した。接着性樹脂として、液状エポキシ樹脂を用い、硬化剤としてアビエチン酸(カルボン酸)を用いた。液状エポキシ樹脂に対し、アビエチン酸を、表1に示す重量比で配合した。このフラックスを基板上に塗布し、230℃のリフロー炉に通炉し、樹脂硬化膜について検証した。

表1

		配合比(wt%)				
配合物	液状エポキシ樹脂	1	1	1	1	1
	アビエチン酸	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50
	溶剤	10	10	10	10	10
	硬化膜物性	硬化せず	ゲル状	硬化膜	硬化膜	ゲル状
	硬化膜硬度			弹性	硬い	

【0045】

表1に示すように、液状エポキシ樹脂1wt%に対し、アビエチン酸1wt%の配合比のとき、硬い硬化膜となり、最も良好な結果が得られる。その他の配合比では、硬化しなかったり、ゲル状になったり、あるいは弹性硬化膜になったりするので、適当でない。リフロー温度に対しては、エポキシ樹脂の配合比、或いは、エポキシ樹脂の分子量、官能基数を変え、硬化剤(カルボン酸)の種類を検討すれば、任意の温度で、所望の硬化膜(接着性)を得ることができる。

【0046】

実施例5

実施例4で調製したフラックスと、はんだ粉末とを混合し、はんだペーストを調製した。はんだ粉末としては、Sn(96.5)Ag(3.5)を用いた。フラックスの含有量は25wt%とした。これを実施例5とする。

【0047】

図11は実施例5のはんだペーストを用いてチップ部品をはんだ付けした場合

、及び、従来のロジン系はんだペーストを用いてチップ部品をはんだ付けした場合について、リフロー温度と部品横押し強度との関係を示す図である。図において、曲線L1は実施例5のはんだペーストを用いた場合の特性、曲線L2は従来のロジン系はんだペーストを用いた場合の特性である。

【0048】

図11に示すように、フラックスを含有するはんだペーストは、220～260℃のリフロー温度範囲において、従来のロジン系はんだペーストよりも高い接合強度を示す。特に、リフロー温度230℃以上で高い接合強度を確保することができた。

【0049】

実施例6

実施例5に示したはんだペーストを用いて、チップ部品を部品搭載基板にはんだ付けし、部品搭載基板とチップ部品の端子極の接合性について観察したところ、フラックスを含有するはんだペーストは、ロジン系はんだペーストと同様の接合性を有していた。因に、従来の導電性接着剤や異方性導電ペーストを上記フラックスと同様に評価した場合、部品搭載基板と部品の端子との接合は得られなかった。

【0050】

上記実施例では、部品搭載基板1の一面に電子部品4を搭載する例を示したが、部品搭載基板1の両面に電子部品4を搭載することができる。この場合、部品搭載基板1の一面上に、本発明に係るはんだペーストによるはんだ付け処理を実行した後、部品搭載基板1の他面上で、本発明に係るはんだペーストとは異なるはんだ、例えば、従来のロジン系はんだペーストを用いて、電子部品4をはんだ付けすることができる。これとは異なって、部品搭載基板1の両面側において、本発明に係るはんだペーストを用いて、電子部品4をはんだ付けすることもできる。何れの場合も、電子部品4がシフティング、マンハッタン現象（部品立ち現象）または脱落等の不具合を起こすことはない。

【0051】

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、次のような効果が得られる。

(a) 実装の高密度化、部品の小型化及び部品の配置間隔の狭ピッチ化等に対しても、十分な接合強度をもって対応し得るはんだ付け用フラックス及びはんだペースト及びはんだ付け方法を提供することができる。

(b) 両面実装タイプの部品搭載基板において、部品の浮動または脱落等の不具合を確実に阻止し得るはんだ付け用フラックス及びはんだペースト及びはんだ付け方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るフラックスを用いたチップ部品のはんだ付け方法を示す部分断面図である。

【図2】

部品搭載基板にはんだ付けされたチップ部品の横押し強度試験方法を示す部分断面図である。

【図3】

図2に示した部品横押し強度試験による結果を示す図である。

【図4】

本発明に係るフラックスを含有するはんだペーストを用いた場合について、部品搭載基板の詳細と、部品搭載基板に対するチップ部品のはんだ付け工程を示す部分断面図である。

【図5】

従来のロジン系フラックスを含有するはんだペーストを用いた場合について、部品搭載基板の詳細と、部品搭載基板に対するチップ部品のはんだ付け工程を示す部分断面図である。

【図6】

図4に示す本発明に係るはんだ付け方法と、図5に示す従来のはんだ付け方法とについて、部品横押し強度試験の結果を示す図である。

【図7】

本発明に係るフラックスを含有するはんだペーストを用いたはんだ付け方法を

示す部分断面図である。

【図8】

図7に示した本発明に係るはんだ付け方法によって、チップ部品を部品搭載基板上にはんだ付けした場合の外観を示す図であって、図7の8-8線に沿った部分断面図である。

【図9】

従来のロジン系フラックス含有のはんだペーストを用いたはんだ付け方法を示す部分断面図である。

【図10】

図9に示した従来のはんだ付け方法によって、チップ部品を部品搭載基板上にはんだ付けした場合の外観を示す図であって、図9の10-10線に沿った部分断面図である。

【図11】

本発明に係るはんだペーストを用いてチップ部品をはんだ付けした場合と、従来のロジン系フラックス含有はんだペーストを用いてチップ部品をはんだ付けした場合のリフロー温度と部品横押し強度との関係を示す図である。

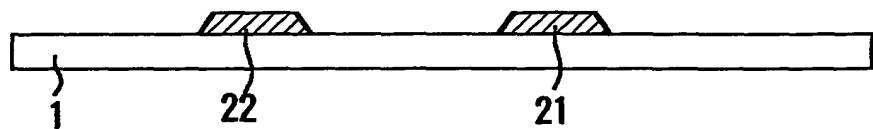
【符号の説明】

1	部品搭載基板
21、22	はんだバンプ
3	フラックス
4	チップ部品
81、82	はんだペースト

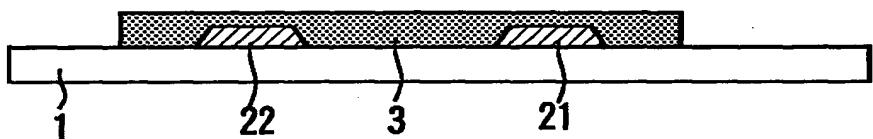
【書類名】 図面

【図1】

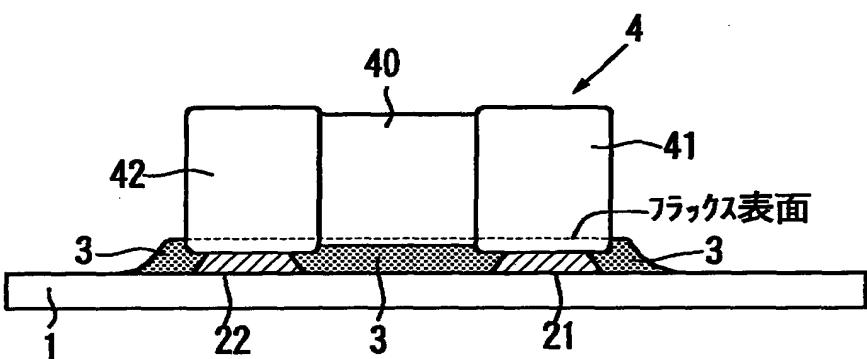
(a)



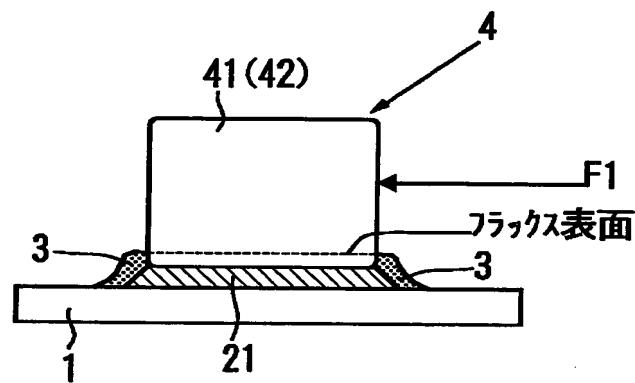
(b)



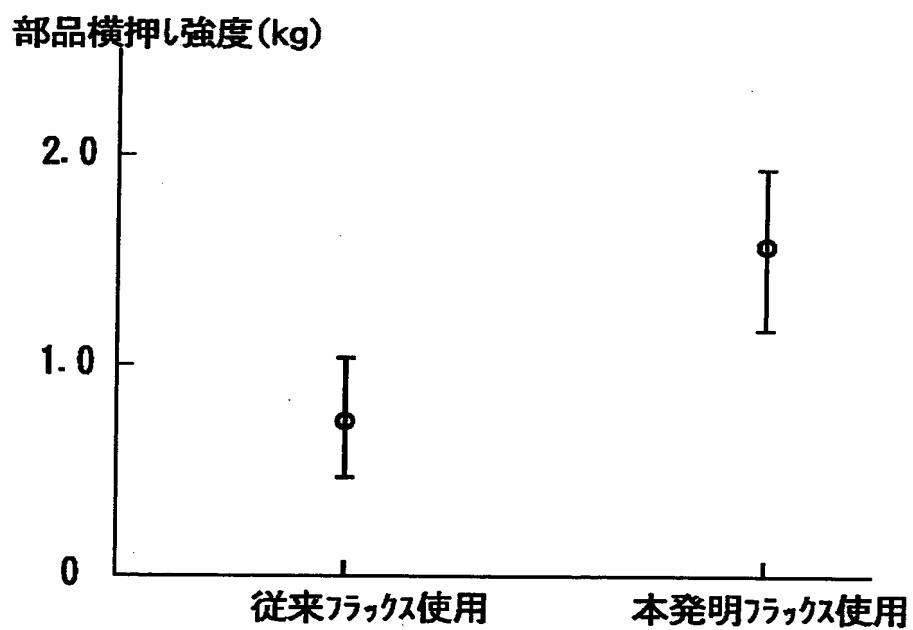
(c)



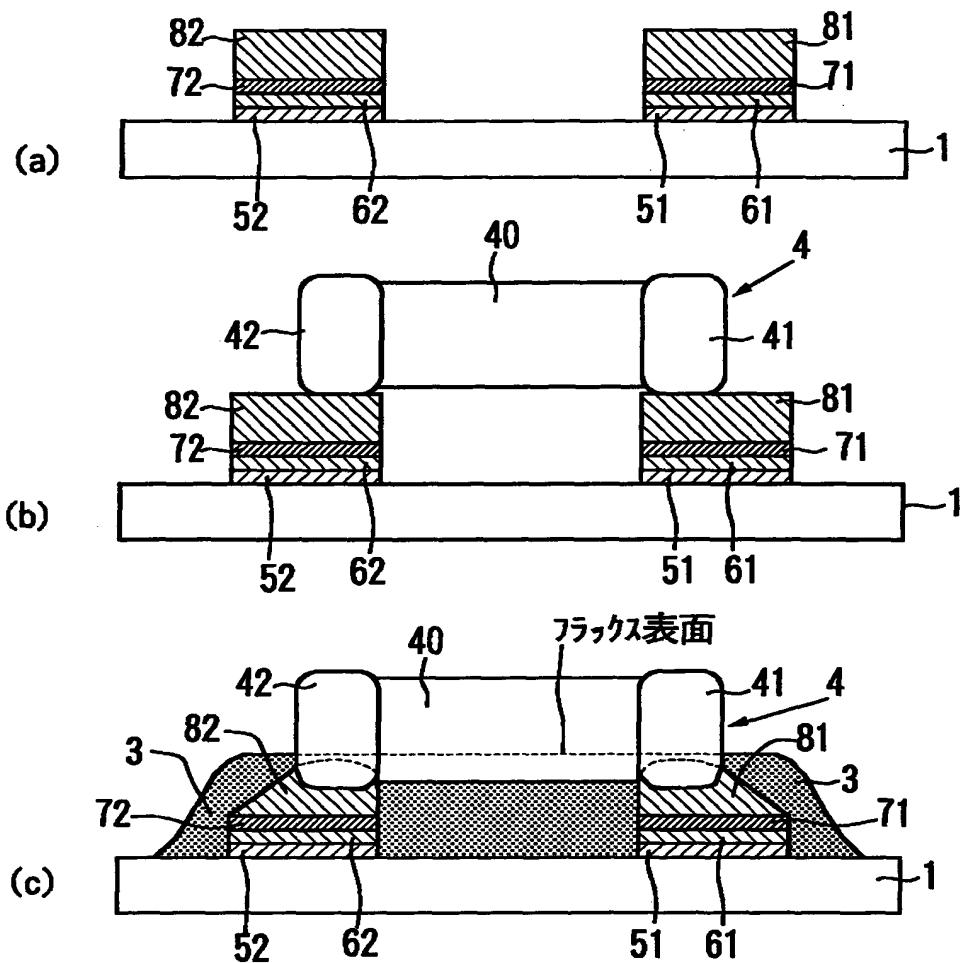
【図2】



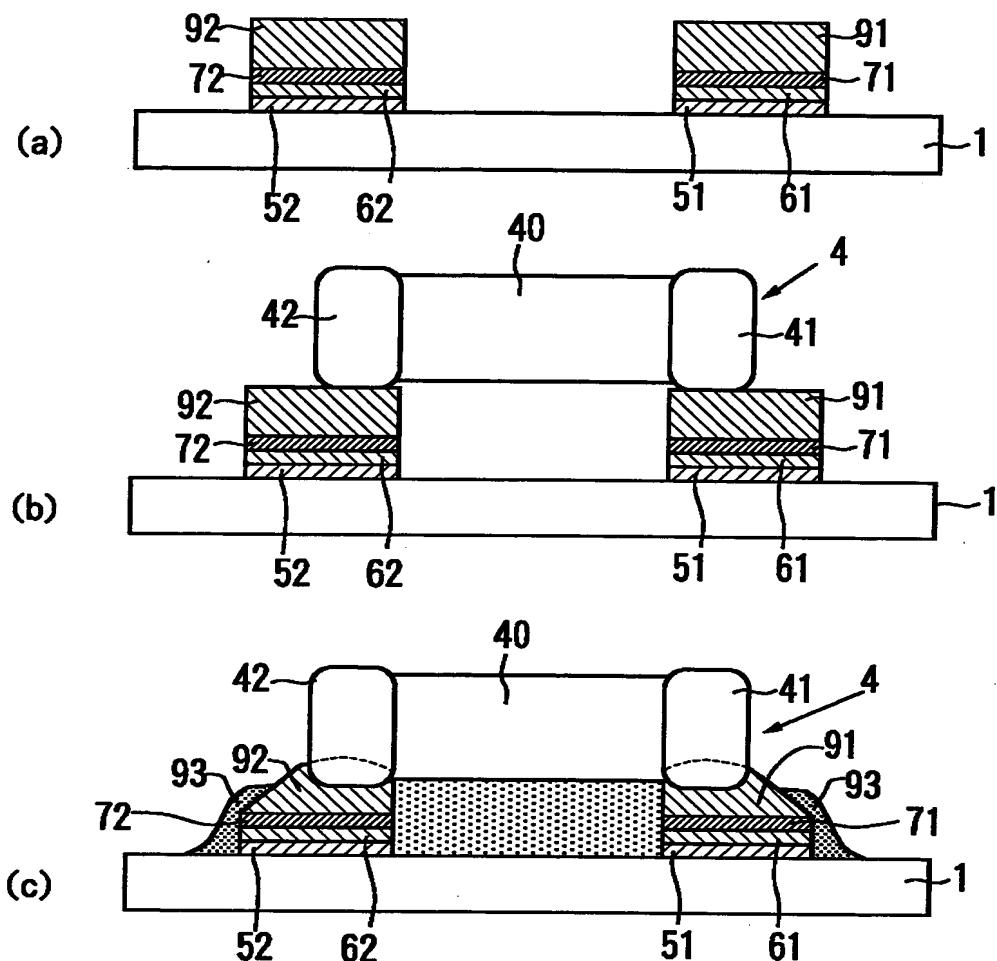
【図3】



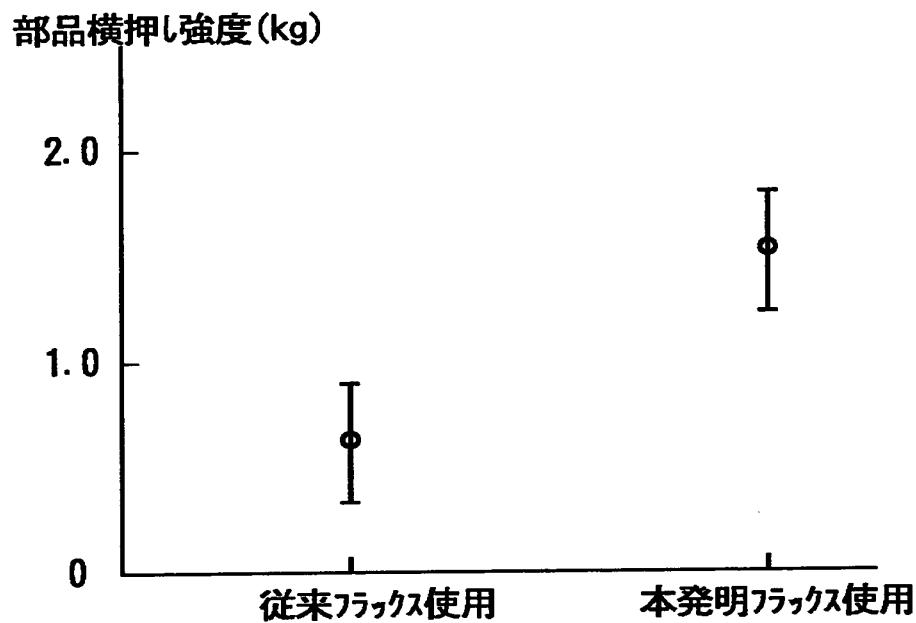
【図4】



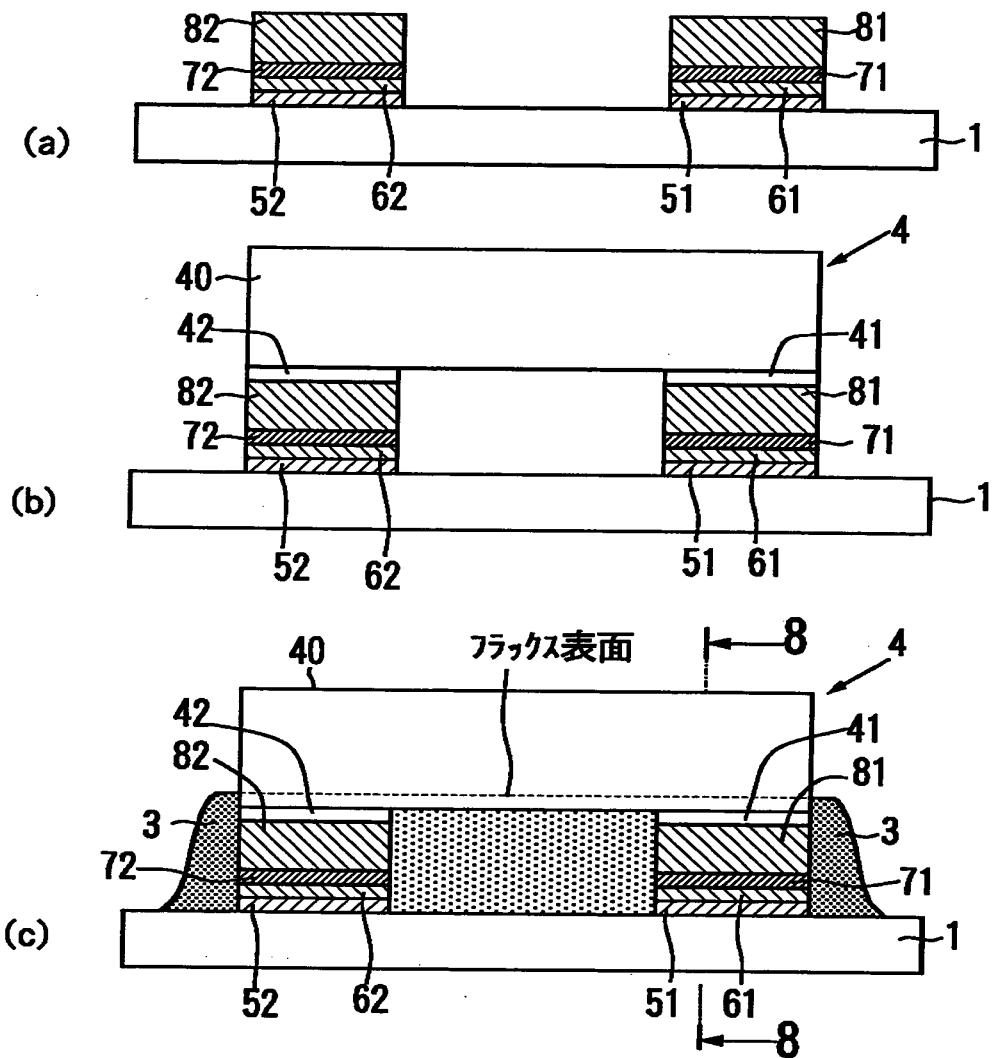
【図5】



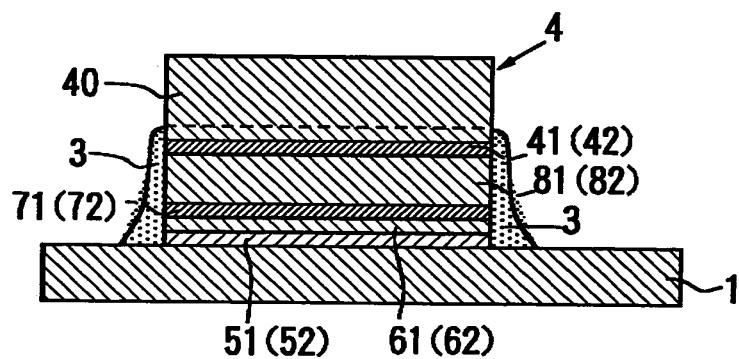
【図6】



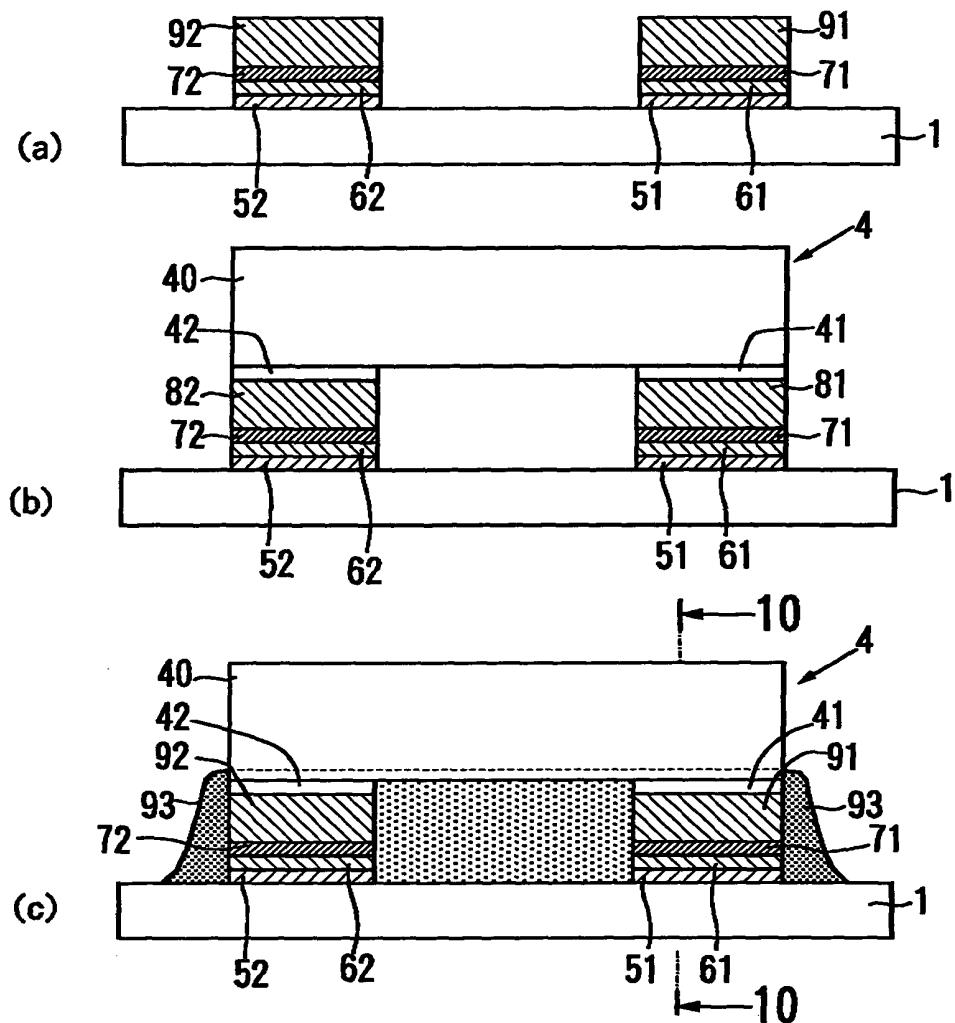
【図7】



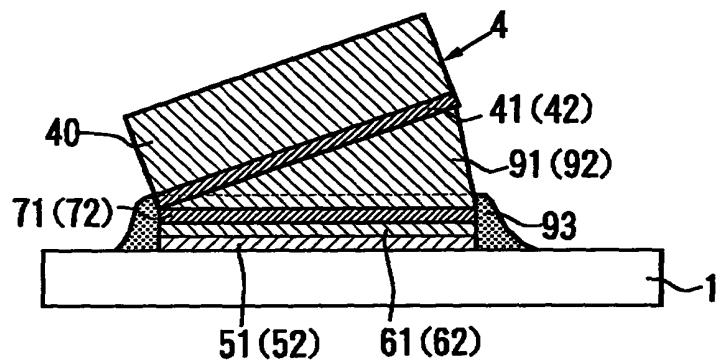
【図8】



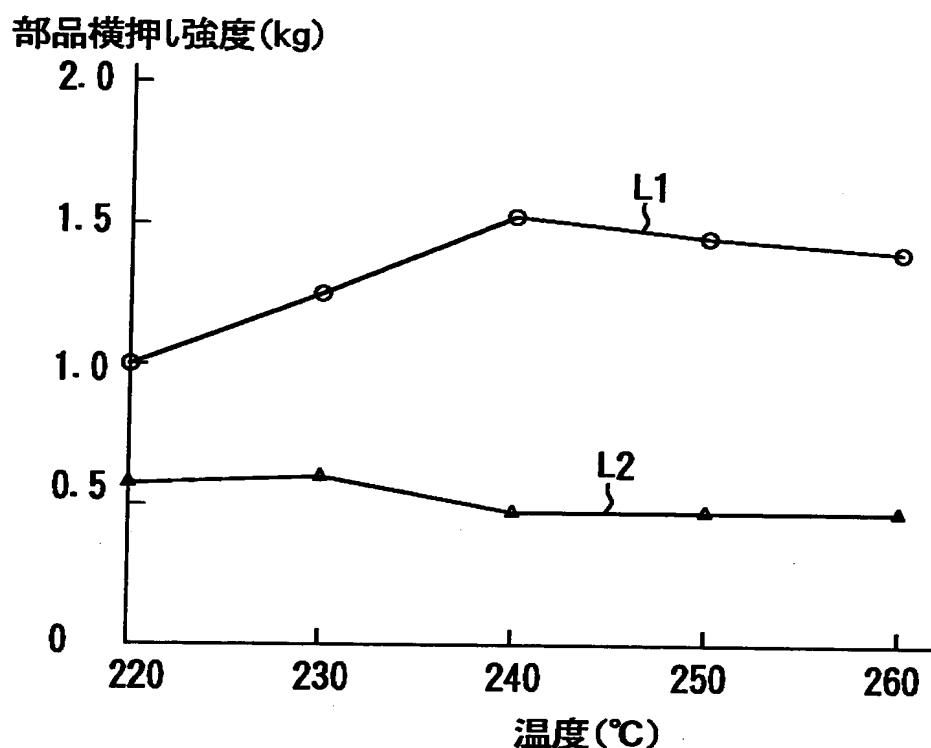
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 実装の高密度化、部品の小型化及び部品の配置間隔の狭ピッチ化等に対しても、十分な接合強度をもって対応し得るはんだ付け用フラックス及びはんだペースト及びはんだ付け方法を提供する。

【解決手段】 フラックス3は、接着性樹脂と、硬化剤とを含有する。このフラックスまたはこれを含有するはんだペーストを、部品搭載基板1の上に塗布し、電子部品4を搭載し、はんだ付けする。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社